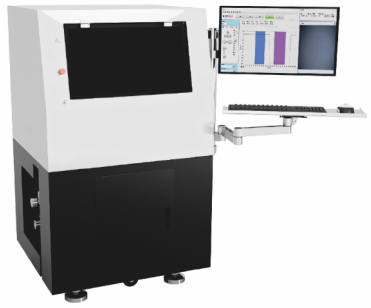
ЭМТИОН | ИННОВАЦИИ ДЛЯ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ

+ **20 лет опыта** успешной реализации проектов с ведущими научными организациями в РФ и СНГ
+ **Российские инженеры** и сервисный центр на территории РФ
+ **ДЕМО лаборатория** для ознакомления с особенностями оборудования
+ **Собственные разработки** и поставки инновационного оборудования
+ **Персонализированные решения** и полное сопровождение проектов — от подбора до внедрения

СТИЛУСНЫЕ ПРОФИЛОМЕТРЫ СЕРИИ JS



Стилусные профилометры серии JS — это современное решение для высокоточного анализа поверхности, предлагающее широкий набор измерительных возможностей при оптимальном соотношении стоимости и эксплуатационных расходов.

Оборудование серии JS позволяет осуществлять контактное (зондовое) профилометрирование с высоким разрешением, обеспечивая измерение шероховатости, высоты ступеней, толщины тонких плёнок, шага структур, радиуса кривизны, а также выявление дефектов (царапины, сколы, кратеры). Приборы ориентированы на лабораторное, исследовательское применение, а также на входной и выходной контроль качества в электронике и микроэлектронике, оптотехнике, металлообработке, энергетике и материаловедении.

ОСОБЕННОСТИ

+ Быстрый, автоматизированный метод анализа профиля и топографии поверхности.
+ Вертикальное разрешение – до 0.05 нм, диапазон измерений по высоте – до 160 мкм.
+ Полностью автоматизированное программное обеспечение с функцией построения 2D профилей и 3D карт поверхности.
+ Работа с образцами диаметром до 300 мм и толщиной до 50 мм.
+ Измерение как плоских, так и сложных криволинейных поверхностей (с возможностью поворота столика).
+ Соответствие международным стандартам ISO 4287, ISO 13565, JIS, ASME.

ВОЗМОЖНОСТИ

+ Определение параметров шероховатости и волнистости по стандартам.
+ Точное измерение толщины тонких плёнок (анализ высоты ступеней).
+ Оценка геометрии элементов: плоскостности, кривизны, радиуса, углов.
+ Выявление зон деформаций, напряжений, микротрещин, сколов, царапин и других дефектов.
+ Анализ микрорельефа для изучения структуры материалов.
+ Построение 3D-топографии для комплексного визуального анализа.

МАТЕРИАЛЫ И ОБЪЕКТЫ

Подходит для металлов, полупроводников, полимеров, керамики, композитов, оптических покрытий, стекла и других твёрдых материалов. Доступна возможность настройки силы прижима зонда для щадящего измерения мягких образцов.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

+ Полупроводниковая промышленность и микроэлектроника
+ Нанотехнологии и материаловедение
+ Машиностроение, металлообработка, прецизионное производство
+ Медицина и биотехнологии (исследование имплантов, биопленок)
+ Оптика и фотоника (линзы, зеркала, дифракционные решётки)
+ Энергетика (солнечные элементы, топливные ячейки)
+ Аэрокосмическая промышленность (лопатки турбин, покрытия)
+ Ювелирная промышленность (контроль качества гравировки и полировки)

ЭМТИОН
ООО НТЦ “ЭМТИОН” | ИНН 7735195944 | тел. +7 (499) 390-90-81
Адрес: РФ, Москва, Зеленоград, Савелкинский проезд, д 4
www.mteon.ru
info@mteon.ru

Модель стилусного профилометра	JS10C	JS100C / JS200C / JS300C	JS3000C
Вертикальное разрешение	0.05 нм		
Горизонтальное разрешение	10 нм		
Повторяемость измерений	≤ 0.5 нм (1 σ, 30 сканов эталона 1 мкм)		
Тип системы	Настольная	Напольная	
Максимальный размер образцов	⌀ 150 мм	⌀ 150 мм ⌀ 200 мм ⌀ 300 мм	⌀ 200 мм ⌀ 300 мм
Максимальная толщина образца	50 мм		
Максимальная длина сканирования (длина изображения)	55 мм (без необходимости прерывания сканирования и сшивки профилей)		
Тип столика	Ручной	Моторизованный	
Тип загрузки образцов	Ручной		Автоматизированный
Виброизоляционная платформа	Отсутствует (опционально)	Встроенная	
Режим отображения топографии	2D	2D / 3D	
Диапазон хода столика по XY оси	100 мм	100 мм 200 мм 300 мм	200 мм и более
Точность хода столика по XY оси	-	±3 мкм	
Диапазон хода столика по Z оси	10 мм		
Диапазон сканирования по Z оси	160 мкм		
Скорость сканирования	От 5 мкм/с до 50 мкм/с		
Усилие давления стилуса	От 0.5 до 50 мг (постоянный контроль)		
Программное обеспечение	Измерение ступеней, шероховатости, плоскостности и др. параметров		
Комплектация	– стилусный профилометр – управляющий ПК и ПО – стилусный зонд		
Доступные опции	Калибровочные образцы, зонды, виброплатформа	Калибровочные образцы, зонды	Калибровочные образцы, зонды, FFU модуль, EFEM (SMIF+манипулятор+загрузчик), модуль интерфейса E84 и др.

СДЕЛАЙТЕ ВАШ НАУЧНЫЙ ПРОЕКТ ЭФФЕКТИВНЕЕ!

- Изучите каталог на www.mteon.ru
- Запросите презентацию с описанием необходимых для Ваших исследований решений
- Свяжитесь с экспертами для консультации или запишитесь на демо измерения: +7 (499) 390-90-81

ЭМТИОН: ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР В СОЗДАНИИ БУДУЩЕГО.
ВДОХНОВЛЯЕМ НА ОТКРЫТИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЕМ РЕЗУЛЬТАТ!

ЭМТИОН

ООО НТЦ “ЭМТИОН” | ИНН 7735195944 | тел. +7 (499) 390-90-81
Адрес: РФ, Москва, Зеленоград, Савелкинский проезд, д 4

www.mteon.ru
info@mteon.ru